

- 오류정정 -

학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 28(3), 6 (2021)
논문제목	“부품 내장 공정을 이용한 5G용 내장형 능동소자에 관한 연구”
요청부분	(pp.6) 절 번호 표기 오류 2.3. 칩 내장형 모듈의 출력 특성 측정
정정	(pp.6) 절 번호 표기 정정 2.4. 칩 내장형 모듈의 출력 특성 측정
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 28(3), 15 (2021)
논문제목	“저온 Cu-Cu본딩을 위한 12nm 티타늄 박막 특성 분석”
요청부분	(pp.15) 참고문헌 저자명 표기 오류 21. Taguchi, and Y. Iijima, “Diffusion of copper, silver and gold in $\alpha$ -titanium”, <i>Philos. Mag. A</i> , 72(6), 1649-1655 (1995).
정정	(pp.15) 참고문헌 저자명 표기 정정 21. O. Taguchi, and Y. Iijima, “Diffusion of copper, silver and gold in $\alpha$ -titanium”, <i>Philos. Mag. A</i> , 72(6), 1649-1655 (1995).
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 28(3), 19 (2021)
논문제목	“물질이동 억제 버퍼층 형성을 통한 페로브스카이트 태양전지 장기 안정성 확보”
요청부분	(pp.19) 글자표기 오류 Fig. 1. (a) Diagram of PSCs that shows possible degradation by the diffusion of silver and iodine through PCBM and BCP layers. (b) Photographs of a PSCs without buffer layers during the high-temperature storage at 85°C. (top: as-prepared, middle: after 6days, and bottom: after 15days)
정정	(pp.19) 글자표기 정정 Fig. 1. (a) Diagram of PSCs that shows possible degradation by the diffusion of silver and iodine through PCBM and BCP layers. (b) Photographs of a PSCs without buffer layers during the high-temperature storage at 85°C. (top: as-prepared, middle: after 6days, and bottom: after 15days)
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 28(3), 38 (2021)
논문제목	“유기 나노 보강층을 활용한 유연 디스플레이용 절연막의 기계적 물성 평가”
요청부분	(pp.38) 참고문헌 권호페이지 표기 오류 13. Z. Gan, C. Wang, and Z. Chen. “Material Structure and Mechanical Properties of Silicon Nitride and Silicon Oxynitride Thin Films Deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition”, <i>Surfaces</i> 1, 59(72) (2018).
정정	(pp.38) 참고문헌 권호페이지 표기 오류 13. Z. Gan, C. Wang, and Z. Chen. “Material Structure and Mechanical Properties of Silicon Nitride and Silicon Oxynitride Thin Films Deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition”, <i>Surfaces</i> 1(1), 59-72 (2018).